

SEM Motic NanoScan TT

НАСТОЛЬНЫЙ СКАНИРУЮЩИЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ МИКРОСКОП



Представляем настольный сканирующий электронный микроскоп **Motic Easy Nanoscan TT**, отличающийся улучшенной электронной колонной, большим увеличением и встроенной обработкой изображений для повышения качества получаемых изображений и лучшего разрешения. Идеально подходит для получения изображений морфологии поверхности, а в сочетании с EDS представляет собой мощный инструмент как для визуализации, так и для элементного анализа состава материалов.

Разрешение	5 нм при 30 кВ (SE)
	10 нм при 30 кВ (BSE)
Катод	Вольфрамовый термоэмиссионный
Ускоряющее напряжение	1–30 кВ

- Простота в использовании
- Высокое разрешение при увеличении 200 000 крат и 30 кВ
- Компактный и лёгкий
- Большой выбор аксессуаров
- Высокая надежность и безопасность

SEM Scietex W30-69

СКАНИРУЮЩИЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ МИКРОСКОП С ТЕРМОЭМИССИОННЫМ ВОЛЬФРАМОВЫМ КАТОДОМ



Сканирующий электронный микроскоп **Scietex W30-69** обладает превосходным качеством изображения, широким спектром аксессуаров и возможностями автоматизации. Доступна версия с возможностью работы в режиме низкого вакуума.

Разрешение	3 нм при 30 кВ (SE)
	6 нм при 1 кВ (BSE)
Катод	Вольфрамовый термоэмиссионный
Ускоряющее напряжение	0–30 кВ

- Предварительно центрированный картридж с вольфрамовой нитью накала
- Трехуровневая электромагнитная коническая линза
- Клапан на электронной колонне гарантирует, что вакуум в области источника не будет нарушен



SEM Scietex F30

СКАНИРУЮЩИЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ
МИКРОСКОП С ПОЛЕВЫМ КАТОДОМ
ТИПА ШОТКИ

Сканирующий электронный микроскоп **Scietex F30** обеспечивает высокое разрешение и производительность работы в том числе в аналитических приложениях благодаря использованию полностью оригинальной электронно-оптической системы собственной разработки и других интеллектуальных разработок. Микроскоп достигает нанометрового разрешения промышленного стандарта, поддерживает множество режимов работы. Области применения: науки о жизни, материаловедение, анализ отказов и геологии.

Разрешение	0.9 нм при 30 кВ (SE) 1.2 нм при 15 кВ (BSE)
Катод	Автоэмиссионный катод типа Шоттки
Максимальное поле зрения	6 мм
Увеличение	1x – 2 500 000x

- Высокое разрешение, широкий диапазон изменения энергии электронов первичного пучка, сверхширокое поле зрения, обеспечивающее съемку в широком диапазоне увеличений от макро- до микромасштабов.
- Высокоскоростная мультidetекторная система сканирования и захвата изображения, поддерживающая сигналы SE и BSE, а также работу с EDS, EBSD, CL и другими аналитическими аксессуарами.
- Внутрлинзовый детектор с энергетическим фильтром вторичных электронов, высокочувствительные детекторы для качественной скоростной съемки, постобработка изображений в реальном времени включая вывод цветного изображения.
- Эффективное шумоподавление и повышение резкости изображения без потери ключевой информации.
- Оптимизированная система выравнивания пучка с полной навигацией по образцу, автоматической настройкой яркости, контраста и фокусировки.

